

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第4区分
 【発行日】平成17年4月21日(2005.4.21)

【公開番号】特開2004-155089(P2004-155089A)

【公開日】平成16年6月3日(2004.6.3)

【年通号数】公開・登録公報2004-021

【出願番号】特願2002-323746(P2002-323746)

【国際特許分類第7版】

B 2 9 C 45/17

B 2 9 C 45/76

【F I】

B 2 9 C 45/17

B 2 9 C 45/76

【手続補正書】

【提出日】平成16年6月11日(2004.6.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

また、コントローラ20は、サンプリング範囲Zsにおける成形データDa...の標準偏差Esに調整係数Kiを乗じて得る監視幅Cwを演算する(ステップS9)。この場合、監視幅Cwは、 $Cw = Es \cdot Ki$ 、即ち、 $Es^2 = \{ (X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_n^2) / n \} - X_s^2 / n$ の平方根にKiを乗じて求めることができる。なお、この監視幅Cwは、サンプリング範囲Zsにおける成形データDa...の標準偏差Esをサンプリング範囲Zsにおける成形データDa...の平均値(基準値Xs)により除した変動係数Uに、調整係数Kjを乗じて求めることもできる。即ち、監視幅Cwは、 $Cw = U \cdot Kj = (Es / Xs) \cdot Kj$ により求めることもできる。いずれの場合も、調整係数Ki, Kjは、各モニタ項目(Ra...)毎に最適な値を設定する。そして、この監視幅Cwは各モニタ項目(Ra, Rb, Rc...)毎に求める。一方、得られた基準値Xsと監視幅Cwは、判別条件として内部メモリ25に設定する(ステップS10)。この場合、正規の設定としてもよいし、必要により仮設定とし、以後の成形において微調整を行ってもよい。